



Technical Specifications



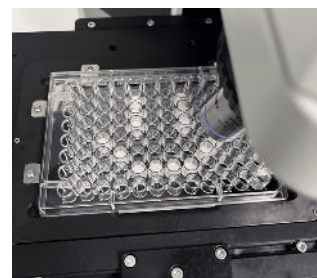
## StellarSCOPE and StellarSCOPE-Auto Mapping Systems for Microscopy



Couple StellarNet spectrometers and light sources to high-performance microscopes

Perform Raman, Fluorescence, Film Metrology, and CIELAB color measurements on a micro-spot and capture high-resolution images, video, and time-lapse video.

Systems equipped with an Olympus research microscope with 4, 10 and 40x objectives, CMOS 1.3 Mpixel camera, optical switch, and required SMA couplers and attachment accessories for your specific application.



### StellarSCOPE-AM (Auto Mapping) Software: StellarPro

User Selectable: wavelength, image dimension or well plate #, step size  
Fast 12x12 image or >2k pixel imaging

### NEW - StellarSCOPE-AM for Auto-Mapping Microscopy Integrated with StellarPro Software

#### StellarSCOPE System Specifications

Optical System	UIS2 (Universal Infinity-corrected) optical system for Raman, Fluorescence, Colorimetry, Thin Film Metrology	
Illumination	Built-in transmitted Koehler illuminator LED Lamp or determined by spectroscopy application	
Focusing	Stage Z height movement by roller guide (rack & pinion) Stroke per rotation: 36.8mm Tension adjustment on coarse focus adjustment knob	
Measurement Stage	<b>StellarSCOPE</b> Size: 188(W) X 134(D)mm Movement range: 76mm X-direction X 50mm Y-direction Specimen holder, Double slide holder, Rubber grip Equipped as standard	<b>StellarSCOPE-AM</b> 100x120mm Travel range 0.15um Microstep Resolution, <2um Repeatability, 85mm/s Max speed, USB Interface, StellarPro Software
Objectives	4, 10, 40x with working distance 18.5mm, 10.6mm, & 0.6mm, others available	
Camera	1.3 Megapixel resolution, image capture, video and time-lapse video modes	
Multi-Mode Feature	Easy adjustment switch between Camera Mode and Spectrometer Mode	



グローバルにネットワークを広げ、最先端の科学をお客様に提供

本 社：〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-18-14 T.ビル

Tel. 03-3686-4711

営業所：〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-46 新大阪北ビル

Tel. 06-6393-7411

URL：https://www.tokyoinst.co.jp Mail：sales@tokyoinst.co.jp



超高真空・極低温走査型プローブ顕微鏡  
高速分光測定装置、クライオスタット



Nd:YAGレーザー、Ti:Sレーザー  
OPOレーザー

- 本カタログに記載されている内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。（製品の仕様、性能、価格などはカタログ発行当時のものです）
- 本カタログに記載されている内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されております。
- 本カタログに記載されているメーカー名、製品名などは各社の商標または登録商標です。